

# Ag-sheathed Bi2223 tape의 교류손실 저감을 위한 oxide barrier의 형성에 관한 연구

이세중, 이득용\*, 배성규, 예경환\*\*, 송요승\*\*

경성대학교 재료공학과, \*대림대학 재료정보과, \*\*한국항공대학교 항공재료공학과

## Preparation of oxide barrier on Ag-sheathed Bi2223 tape for the reduction of AC loss

Se-Jong Lee, Deuk Yong Lee\*, Seong-Kyu Bae, Kyung-Hwan Ye\*\*, and Yo-Seung Song\*\*

Department of Materials Engineering, Kyungsung University, Pusan 608-736, Korea

\*Department of Materials Engineering, Daelim College of Technology, Anyang 431-715, Korea

\*\*Department of Materials Engineering, Hankuk Aviation University, Koyang 412-791, Korea

E-mail: lsjong@ks.ac.kr

Abstract - SrZrO<sub>3</sub> resistive oxide barriers on Ag sheathed Bi2223 tapes prepared by the sol-gel and dip coating method were evaluated with an aid of Taguchi method and orthogonal arrays to elucidate the effects of experimental parameters, such as ratio of starting solution, amount of additives, and heat treatment temperature and time on the properties of the thin films. Six experimental parameters were selected and then L18(21x37) orthogonal arrays were constructed. Finally, SEM and XRD results were related to signal to noise (S/N) ratio to evaluate the optimized experimental condition.

coating하여 제조하였다. 실험변수로는 출발원료의 비 (strontium acetate hemihydrate/zirconium(IV) propoxide), 건조시간 및 온도, 열처리 온도 및 시간을 변화시키면서 오차범위 내에서 각 변수들을 조정 설계하는 Taguchi 방법의 허용차 설계와 직교배열표 (L18(21x37))를 이용하여 실험의 결과치를 Taguchi 방법의 S/N비로 변환하였다 [6]. 변환시킨 S/N 비를 통한 망소특성 (small-is-better performance)에 따라 분산분석 (analysis of variance, AOB)하여 공정변수들의 최적 조건과 제어변수가 교류손실에 미치는 영향을 고찰하였다.

### 1. 서 론

초전도체는 교류 자기장 하 (AC magnetic field)에서 사용되기 때문에 교류 손실 (AC loss)이 발생하는 문제점이 있다 [1-5]. 일반적으로 교류손실은 두가지 형태로 초전도체의 이력 자화 (hysteretic magnetization)와 matrix 자체의 ohmic 전류 유도에 의한 것으로 알려져있다 [1,2]. 이력자화에 의한 손실은 초전도체를 다수의 필라멘트로 제작하면 감소시킬 수는 있지만 [2,3], 상용되는

Ag-sheathed Bi2223 tape의 경우에는 Ag의 우수한 전도성 (conductivity)에 의하여 상쇄되는 문제점을 갖고 있다 [1]. 교류 손실현상을 억제하기 위하여 Ag-sheathed tape 표면에 수 μm 두께의 절연층을 코팅하는 연구가 현재 개발 중에 있다 [1-5].

본 연구에서는 초전도체인 Bi2223과 반응이 없어 전기적 특성을 저해하지 않으면서 가격이 저렴한 [1] SrZrO<sub>3</sub>를 Ag-sheathed Bi2223 tape 표면에 절연층으로 졸-겔법을 이용하여 dip

### 2. 본 론

#### 2.1 실험방법

##### 2.1.1 sol-gel precursor 제조

[7]Strontium acetate hemihydrate 와 glacial acetic acid를 혼합 교반 후 80℃로 유지하고 Zirconium(IV) propoxide를 위와 같이 glacial acetic acid와 혼합한 후 acetylacetone 을 첨가하였다. 그리고 마지막으로 두 용액을 80℃에서 2시간 가량 교반 한 후 0.5mol 되게 H<sub>2</sub>O로 dilute 하였다. 마지막으로 위 결과 용액에 ethyl cellulose와 a - terpineol를 60℃에서 혼합하여 첨가하였다.

출발원료	Strontium acetate hemihydrate	Zirconium(IV) propoxide ~70% in propanol
용 매	glacial acetic acid	
chelating agent	acetylacetone	
첨가제	ethyl cellulose	
용매	a - terpineol	



변수	A	B	C	D	E	F
수준	A1 : 1.01g / 0.66ml	B1 : 1wt%	C1 : 100°C	D1 : 5분	E1 : 500°C	F1 : 10분
	A2 : 0.72g / 1.09ml	B2 : 3wt%	C2 : 130°C	D2 : 10분	E2 : 600°C	F2 : 15분
	A3 : 0.43g / 1.52ml	B3 : 5wt%	C3 : 160°C	D3 : 15분	E3 : 700°C	F3 : 20분

- 제어변수 A, B, C, D, E, E, F를 조합하여 3수준으로 정해진 직교 배열표 L18(2<sup>1</sup>×3<sup>7</sup>)의 각 위치에 배열하였고 각 실험번호에 맞추어 피막을 제조하였다. 각 실험 번호에 해당하는 결과 값을 SN비 값으로 변환하고 열소 특성을 적용하여 공정의 최적화 및 제어 변수가 피막에 미치는 영향을 분석하였다.

Table 1. Experimental Layout of L<sub>18</sub>(2<sup>1</sup>×3<sup>7</sup>)

실험 번호	실험 변수							e
	e	A	B	C	D	E	F	
1-1	-	1.01g / 0.66ml	1	100°C	5분	500°C	10분	-
1-2	-	1.01g / 0.66ml	3	130°C	10분	600°C	15분	-
1-3	-	1.01g / 0.66ml	5	160°C	15분	700°C	20분	-
1-4	-	0.72g / 1.09ml	1	100°C	10분	600°C	20분	-
1-5	-	0.72g / 1.09ml	3	130°C	15분	700°C	10분	-
1-6	-	0.72g / 1.09ml	5	160°C	5분	500°C	15분	-
1-7	-	0.43g / 1.52ml	1	130°C	5분	700°C	15분	-
1-8	-	0.43g / 1.52ml	3	160°C	10분	500°C	20분	-
1-9	-	0.43g / 1.52ml	5	100°C	15분	600°C	10분	-
1-10	-	1.01g / 0.66ml	1	160°C	15분	600°C	15분	-
1-11	-	1.01g / 0.66ml	3	100°C	5분	700°C	20분	-
1-12	-	1.01g / 0.66ml	5	130°C	10분	500°C	10분	-
1-13	-	0.72g / 1.09ml	1	130°C	15분	500°C	20분	-
1-14	-	0.72g / 1.09ml	3	160°C	5분	600°C	10분	-
1-15	-	0.72g / 1.09ml	5	100°C	10분	700°C	15분	-
1-16	-	0.43g / 1.52ml	1	160°C	10분	700°C	10분	-
1-17	-	0.43g / 1.52ml	3	100°C	15분	500°C	15분	-
1-18	-	0.43g / 1.52ml	5	130°C	5분	600°C	20분	-

## 2.3 실험결과분석

### 2.3.1 XRD 분석

그림1에서 보여준 XRD pattern은 앞의 실험 계획에서 각 변수들의 기준 값으로 정한 조건에서 1 cycle 행한 시편의 분석값이다.

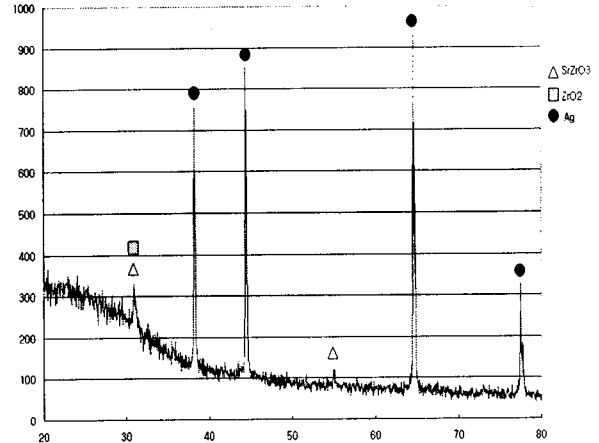


Fig. 1. XRD pattern of SrZrO<sub>3</sub> film on Ag tape

### 2.3.2 SEM 분석

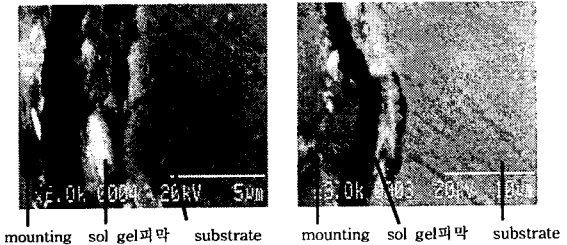


Fig. 2. SEM micrographs of SrZrO<sub>3</sub> film on Ag tape

그림2에서 보여준 SEM 사진은 앞의 실험 계획에서 각 변수들의 기준 값으로 정한 조건에서 1 cycle 행한 시편의 분석사진이다.

## 3. 결론

- SrZrO<sub>3</sub> sol-gel precursor를 만들어 Ag tape에 생성 시켰다.
- 1회 dipping 후 건조시켜 SEM과 XRD로 피막을 관찰한 결과 막의 두께가 부분적으로 얇고 균일하지 않음을 알 수 있었다. 따라서 dipping cycle를 증가시키고, 유기 화합물을 첨가하여 실험이 진행될 것이다.
- 앞으로 현재 진행중인 SrZrO<sub>3</sub> 피막 생성 실험을 다구치 계획법에 의해 단계적으로 진행시켜 나갈 것이다. 또한 AC loss barrier로서의 BaZrO<sub>3</sub>와 BaSrZrO<sub>3</sub> 피막 증착 실험도 다구치 방법으로 계획하여 진행해 나갈 것이다.
- 코팅된 시편으로 AC loss 값을 측정한 후 다구치 분석 방법에 의해 SN비로 변환하여 우리가정한 각 변수들의 기여도를 분석하고, 최적의 조건을 도출 할 것이다.

본 연구는 21세기프론티어 연구개발사업인 차세대초전도응용기술개발 사업단의 연구비 지원에 의해 수행되었습니다.

### [참 고 문 헌]

[1] G. Wiz, M. Dhalle, R. Passerini, X.-D. Su, Y. B. Huang, A. Erb, and R. Flukiger, "ac Losses in Bi,Pb(2223) barrier tapes," *Cryogenics*, 41, 97-101, 2001.

[2] H. Eckelmann, M. Quilitz, M. Oomen, M. Leghissa, and W. Goldacker, "AC losses in multifilamentary Bi(2223) tapes with an interfilamentary resistive carbonate barrier," 310, 122-126, 1998.

[3] K. Kwasnitza, S. Clerc, R. Flukiger, and Y. Huang, "Reduction of alternating magnetic field

losses in high-Tc multifilament Bi(2223)/Ag tapes by high resistive barrier," *Cryogenics*, 39, 829-841, 1999.

[4] M. Dhalle, A. Polcari, F. Marti, G. Witz, Y. B. Huang, R. Flukiger, St. Clerc, and K. Kwasnitza, "Reduced filament coupling in Bi(2223)/BaZrO<sub>3</sub>/Ag composite tapes," *Physica C*, 310, 127-131, 1998.

[5] Y. B. Huang, M. Dhalle, F. Marti, G. Witz, and R. Flukiger, "Oxide barriers and their effect on AC losses of Bi,Pb(2223) multifilamentary tapes," *IEEE Trans. Appl. Superconductivity*, 9(2), 1173-1176, 1999.

[6] K. Dehand, *Quality engineering in production system*, McGraw-Hill Book Co., New York, USA, 1985.

[7] J. Eschenbaum, *Solid State Ionics* 77(1995) 222-225